

Satellite Workshop zur PRORA 2005 Tagung am Samstag, den 26. November 2005, zu

Aktuelle Fragen der Röntgenanalytik - Quo vadis XRF ?

anlässlich des Erscheinens des „Handbook of practical XRF“ beim Springer Verlag

Veranstalter: B. Beckhoff, B. Kanngießer, N. Langhoff, R. Wedell und H. Wolff
(Herausgeber des „Handbook of practical XRF“)

Ort: großer Hörsaal bei BESSY, Albert-Einstein-Str. 15, 12489 Berlin-Adlershof

Teilnahmegebühr: 20 € (vor Ort oder vorab an das PRORA Veranstaltungsbüro zu entrichten)

Anmeldung: bitte per email an Dr. Reiner Wedell (wedell-iap@ifg-adlershof.de) bis 18.11.05

Struktur: Veranstalter moderierte Vorträge und Diskussionen zu Themenschwerpunkten

Programm:

9:30 Begrüßung seitens der Veranstalter

9:40 Themenblock I:

Prof. Dr. H. Ebel (TU Wien) und Prof. Dr. M. Mantler (TU Wien)

Vergleich verschiedener Fundamentalparameter-Datenbanken, Modellierung von M- und L-Röntgenröhrenemissionen, Stand der (referenzprobenfreien) Fundamentalparameter gestützten Quantifizierung in der Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF)

11:10 Kaffeepause

11.30 Themenblock II:

Dr. P. Hoffmann (TU Darmstadt) und Dr. G. Weseloh (MPI Golm)

Anwendungen und Anforderungen in Nano und Life Sciences

13:00 Mittagsbuffet

14:00 Themenblock III:

Prof. Dr. C. Vogt (U Hannover), Dr. A. Haibel (HMI) und Prof. Dr. U. Panne (BAM)

Mikroanalytik (XRF und Tomographie) und (heterogene) Referenzmaterialien

15:50 Fazit seitens der Veranstalter: *Herausforderungen und Perspektiven*

Im Anschluß an den Workshop besteht ab 16:00 die Möglichkeit der Besichtigung folgender Einrichtungen:

- RFA und TRFA Anlagen im PTB Labor bei BESSY II (B.Beckhoff, M.Müller)
- μ -Spot Beamline bei BESSY II (B.Kanngießer, W.Malzer)
- BAMline bei BESSY II (H.Rieseemeier, M.Radtke)
- Röntgenoptiklabor und -fertigung bei IFG (N.Langhoff, A. Bjeoumikhov)